

---

産業応用フォーラム開催のご案内  
産業応用フォーラム「電磁界解析による回転機的设计・性能評価技術」

**概要：**回転機的设计および評価のために必須のツールとなりつつある電磁界解析について、利用の現状と最新の技術について紹介します。

電磁界解析は、回転機に対する高性能化要求と製品開発プロセスの効率化追求を背景に、より多くの場面で利用されるようになってきました。実際、電気機器の省エネ化やハイブリッドカーの開発などにおいて、電磁界解析技術は回転機の高効率化に大きく寄与しています。

本フォーラムでは、電磁界解析の実際の利用状況、ベンチマークモデルによる現在の解析技術の評価、解析技術の動向について解説します。

本フォーラムは「電磁界解析による回転機的设计・性能評価技術調査専門委員会」（設置期間：2007年4月～2009年3月）のメンバーを講師とし、回転機的设计開発および電磁界解析にかかわる技術者、研究者、学生等の皆様に広く対象として、同技術報告書の内容をわかりやすく解説いたします。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

**日時：**2010年(平成22年)6月16日(水)13:00～17:00

**会場：**電気学会会議室

〒102-0076 東京都千代田区五番町6-2 HOMAT HORIZONビル8階

JR総武線(中央線各駅停車)市ヶ谷駅下車、徒歩2分

東京メトロ有楽町線・南北線、都営地下鉄新宿線市ヶ谷駅下車、3番出口より徒歩2分

地図はこちらをご覧ください。<http://www2.iee.or.jp/ver2/honbu/31-doc-honb/map.pdf>

---

**プログラム：**

- |                 |                          |               |
|-----------------|--------------------------|---------------|
| (1) 13:00-13:10 | 開会挨拶                     | 山田隆(JSOL)     |
| (2) 13:10-13:40 | 解析技術の利用状況(アンケート調査結果を中心に) | 藤田真史(東芝)      |
| (3) 13:40-14:15 | 設計現場における利用の実例            | 矢口博之(本田技術研究所) |
| (4) 14:15-14:50 | 解析評価用ベンチマークモデルと測定<br>休憩  | 赤津観(芝浦工業大学)   |
| (5) 15:00-15:35 | 解析による特性評価                | 成田一行(JSOL)    |
| (6) 15:35-16:10 | 最新の損失解析および材料モデリング技術      | 山崎克巳(千葉工業大学)  |
| (7) 16:10-16:45 | 連成解析および新しいシミュレーション技法     | 河瀬順洋(岐阜大学)    |
| (8) 16:45-16:55 | 総合討論                     |               |
| (9) 16:55-17:00 | 閉会                       |               |

---

**テキスト：**電気学会技術報告1168号「電磁界解析による回転機的设计・性能評価技術」(定価2,940円)をテキストとして使用します。なお、希望者には特別価格(2,500円、または、会員の方へは2,100円)で頒布しますので、お申し込み時にその旨を記載ください。

**参加費：**一般 会員¥5,000.- (非課税) 非会員¥7,350.- (消費税込) (テキストは含まれません)  
学生 会員¥2,000.- (非課税) 非会員¥2,500.- (消費税込) (テキストは含まれません)

**申込方法：**○電気学会ホームページからのお申込み：<http://www.iee.or.jp/forum.html>

**お問い合わせ：**(株)東芝 藤田真史：[masafumi1.fujita@toshiba.co.jp](mailto:masafumi1.fujita@toshiba.co.jp)【注(at)を@に置き換えて送信してください。】

**参加費支払い方法：**参加費は、当日に現金でお支払い願います。領収書は、原則としてフォーラム当日の日付で会場渡しとなりますが、その他のご指示がある場合は申込時にご連絡ください。

**主催：**電気学会産業応用部門 回転機技術委員会(田村 淳二 委員長)

**共催：**電気学会「電磁界解析による回転機の実用的性能評価技術調査専門委員会」

電気学会「電磁界解析高度利用技術調査専門委員会」